

ZnO膜表面の形状観察

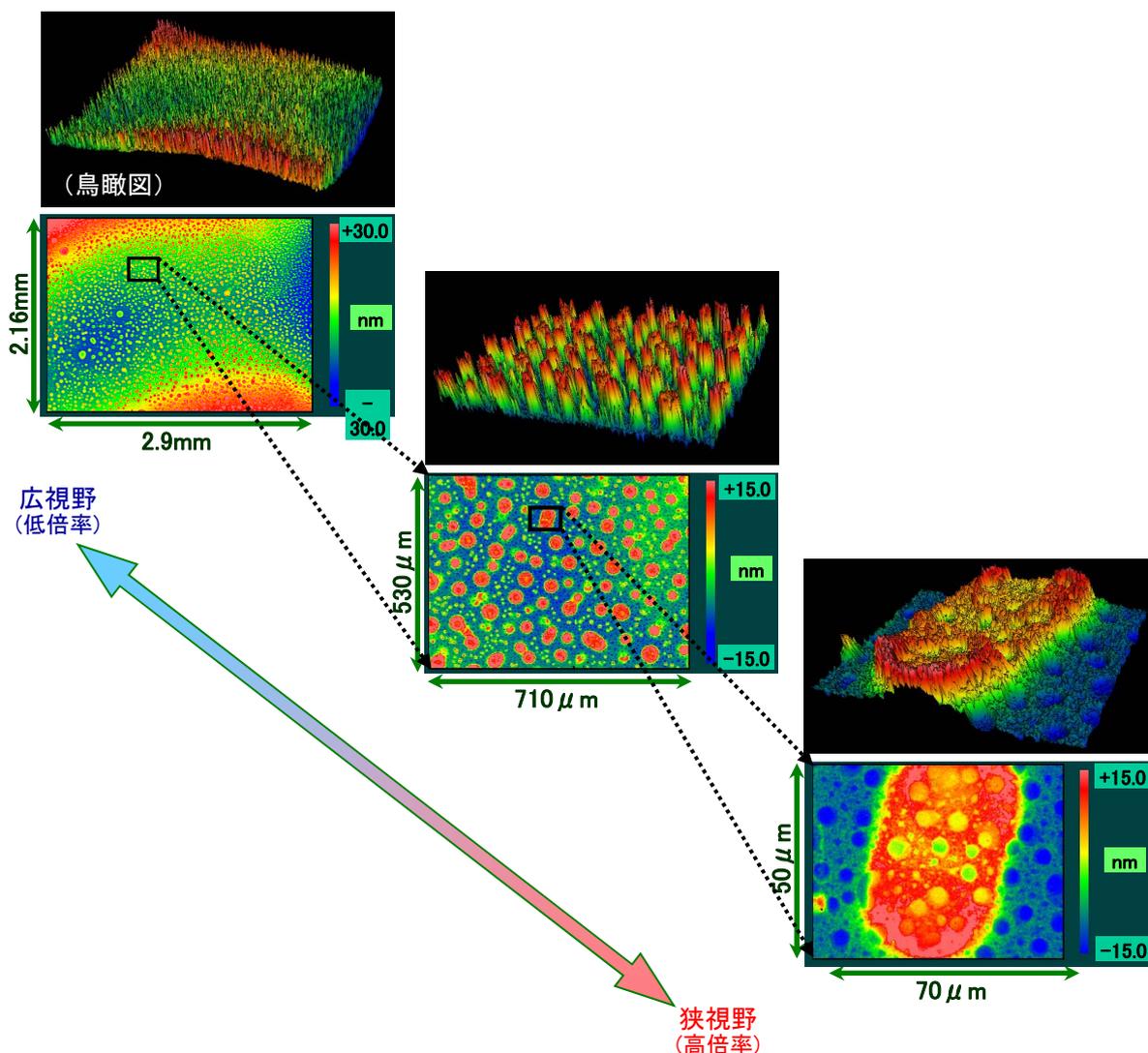
広域の表面形状観察が可能

測定法 : 白色干渉計測法
製品分野 : 電子部品
分析目的 : 形状評価

概要

走査型白色干渉計(光干渉計)は、試料の表面形状を「高い垂直(Z)分解能(0.1nm)と広い(X-Y)測定視野(50 μ m~5mm)」で高精度に、非接触3次元測定を行うことが可能です。5mm \times 5mmの視野まで測定可能です。

データ



サンプルご提供: 信州大学 工学部 電気電子工学科 橋本佳男先生

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <https://www.mst.or.jp/>